

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-294220

(43)公開日 平成7年(1995)11月10日

(51) Int.Cl.⁶
G 0 1 B 11/06

識別記号 庁内整理番号
G

F I

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数6 O L (全5頁)

(21)出願番号 特願平6-89517

(22)出願日 平成6年(1994)4月27日

(71)出願人 000005968

三菱化学株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目5番2号

(72)発明者 工藤 重樹

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱

化成株式会社総合研究所内

(72)発明者 野村 一雄

神奈川県横浜市緑区鴨志田町1000番地 三菱

化成株式会社総合研究所内

(72)発明者 成合 正憲

神奈川県茅ヶ崎市円蔵370番地 三菱化成

株式会社茅ヶ崎事業所内

(74)代理人 弁理士 小林 将高

(54)【発明の名称】 多層薄膜の膜厚検出方法および装置

(57)【要約】

【目的】 多層薄膜の膜厚検出を高速、かつ高精度に検出可能とする。

【構成】 試料10に白色光源1から白色光を光ファイバ2を介して照射し、試料10より反射した光を光ファイバ3を介して分光器4に入射させて分光し、そのスペクトルを高速フーリエ変換してエネルギースペクトルをマルチチャネルディテクタ5から得た後、信号処理器7で信号処理して多層薄膜の膜厚を得る構成を特徴としている。

